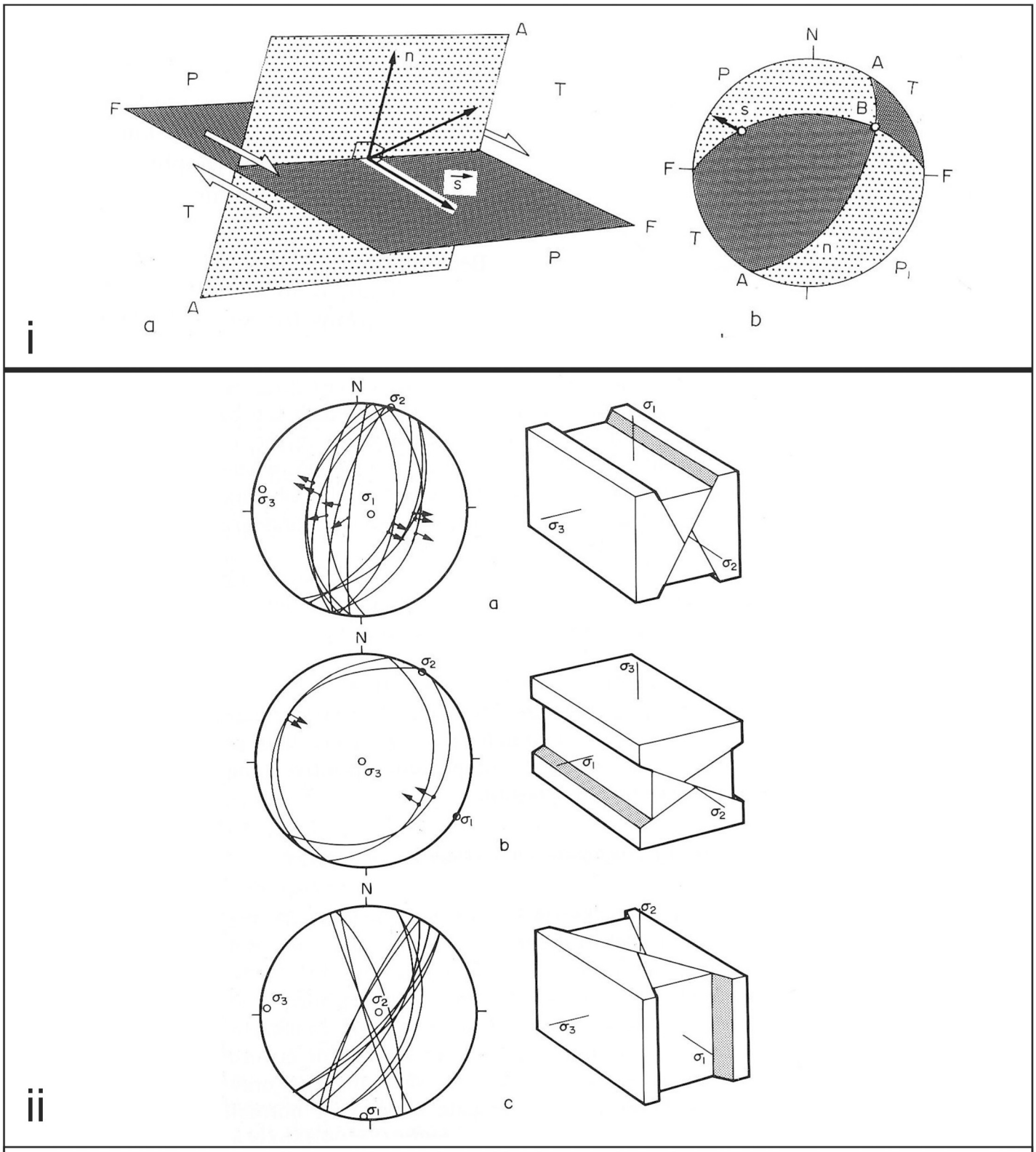
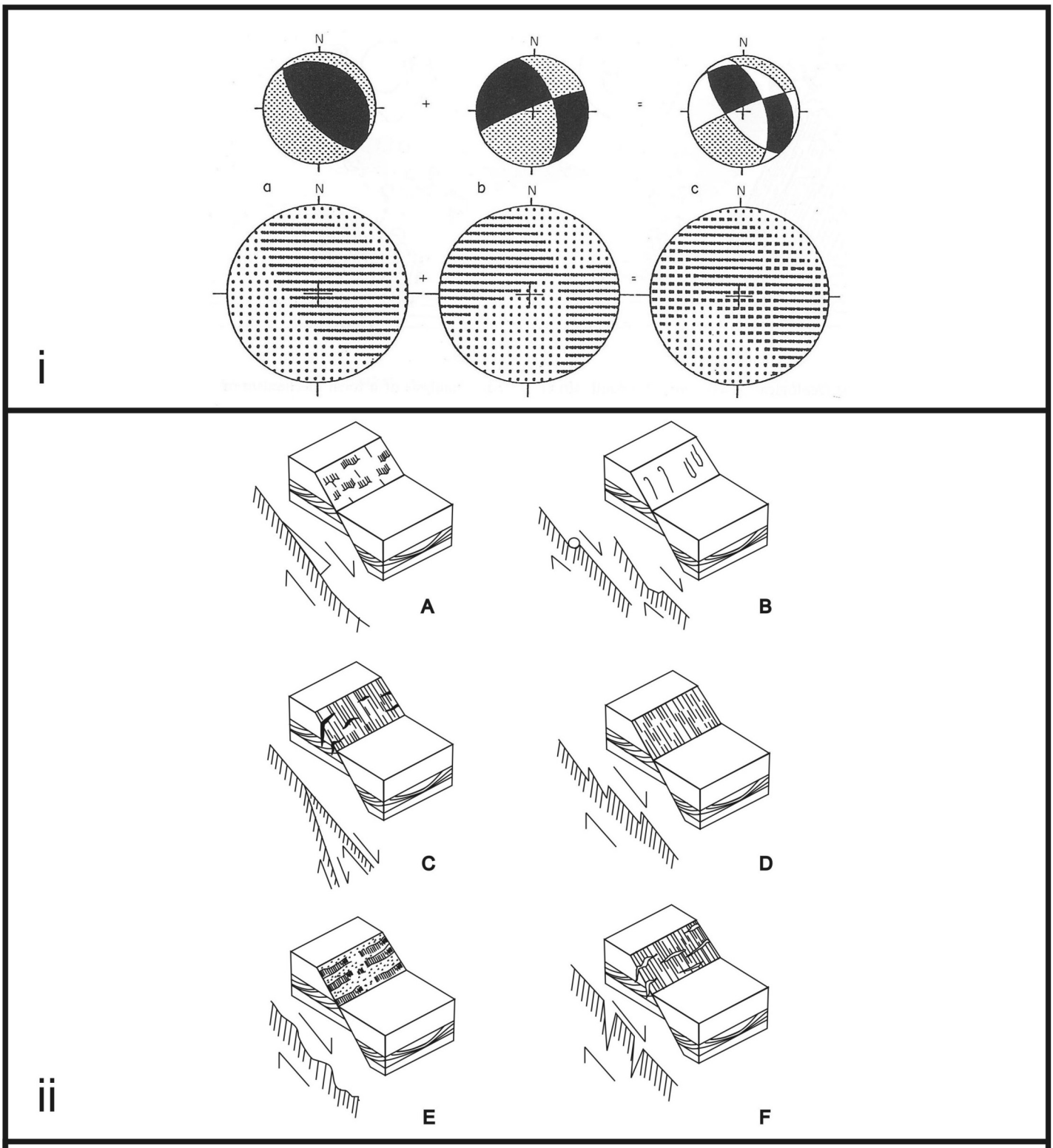


Prancha 3: i) Diedros retos e o mecanismo de movimento de falha. (a) Visão perspectiva. (b) Plotagem estereoscópica, hemisfério inferior. F, plano de falha; A, plano auxiliar; n, normal ao plano de falha (vetor unitário); s, vetor unitário de mivimento em (a), estria reversa destral em (b); B, intersecção dos planos A e F; P, diedro compressivo; T diedro distensivo. Retirado de Angelier (1994).

ii) Exemplos comuns de sistemas conjugados de falhas, representados como traços ciclográficos (grandes círculos) com vetores de movimento representados como pólos (pontos e flechas). (a) Falhas *dip-slip*normais. (b) Falhas reversas *dip-slip.*(c) Falhas *strike-slip* verticais. À esquerda: estereogramas (projeção de Schimidt, hemisfério inferior). Principais eixos de tensão: σ1, σ2 e σ3. Retirado de Angelier (1994).



Prancha 4: i) Princípio do método dos diedros retos. Projeção em rede estereográfica de Schimidt, hemisfério inferior. (a) e (b) Caso simples de duas falhas com o resultado mostrado em (c). Linha superior: Aplicação gráfica, com mecanismos de falha ou terremotos (pontilhado – diedro compressivo, preto – diedro distensivo); domínios de incompatibilidade deixados em branco em (c). Linha inferior:aplicação numérica, com porcentagens (total compatibilidade para compressão = 0, total compatibilidade para distensão = 100, incompatibilidade máxima = 50). Retirado de Angelier (1994).

ii) Critérios usados no trabalho de campo para determinação de movimento em superfície de falha, mostrados no exemplo como falhas normais dip-slip. O critério pode ser aplicado em qualquer tipo de movimento. (A) Degraus minerais. (B) Marcas tectônicas de objeto. (C) Cisalhamento de Riedell. (D) Picos estilolíticos. (E) Facetas alternadas polidas e ásperas. (F) Fendas tensionais. Modificado de Angelier (1994).